



kingston.com/memory-cards

INDUSTRIAL SD 内存卡

经测试可承受极端环境因素

Kingston 的 Industrial SD 卡在各项工业应用中提供卓越的耐用性和可靠性，包括自动化、电信、数据系统、楼宇管理和 POS 系统等。它的设计和测试能够承受最苛刻的环境因素。Kingston 的工业 SD 卡的工作温度为 -40°C 至 85°C，可以在更大的温度范围内正常工作。该卡采用行业领先的 pSLC 模式，提供高达 100MB/秒的可靠读取速度¹。不仅提供多达 1920 的额定 TBW² 和多达 3 万个额定 P/E 周期，还具备耐用性、性能和工业需求方面的内置特性。Kingston 的工业 SD 具有 8GB-64GB 的容量³。

- › 在极端温度下具有耐用性
- › 高耐用性
- › UHS-I Speed Class U3、V30、A1
- › 工业级内置特性

产品特性/优点

在极端温度下具有耐用性 — 经过精心设计和严格测试，能够经受 -40°C 至 85°C 的广泛温度范围，适用于恶劣的环境。

高度耐用性和可靠性 — 多达 1920 的 TBW² 和 3 万个额定 P/E 周期，可满足广泛工业应用的要求。

UHS-I 兼容 — 速度高达 100MB/秒¹，符合 U3、V30 和面向 Android 应用的 A1 标准。

工业级内置特性 — 磨损均衡、坏块管理，以及用于管理闪存卡生命周期的可选运行监控工具⁴。

产品规格

容量³

8GB、16GB、32GB、64GB

性能¹

Class 10、UHS-I、U3、V30、A1

耐用性²

多达 1920 TBW
3 万个 P/E 周期

NAND

pSLC 模式的 TLC

尺寸

24mm x 32mm x 2.1mm

格式

适用于 SDHC 的 FAT32 和适用于 SDXC 的 exFAT

工作温度和保存温度

-40°C 至 85°C

电压

3.3V

工业特性

- 坏块管理
- 电源故障保护
- 磨损均衡
- 自动刷新读取分布保护
- 动态数据刷新
- SiP – 系统级封装
- 垃圾回收
- 运行监控

热循环测试

在各种极端温度下完成的间隔测试

剧烈温湿偏置测试

数百小时测试，用于确保不同湿度水平下的耐用性

宽温实验室测试

生产前对所有 SDIT 卡进行了此测试

保固⁴

3 年

防水⁵



抗冲击和抗震⁷



耐温⁶



抵御机场 X 光⁸



产品型号

Industrial SD 内存卡
SDIT/8GB
SDIT/16GB
SDIT/32GB
SDIT/64GB

1. 速度可能因主机和设备配置的不同而有所差异。
2. 写入 TB 数 (TBW) 根据最大容量的耐用性得出，并基于量化闪存卡在生命周期内可写入多少数据的指标。
3. 闪存设备上所列容量有部分会用于格式化及其他功能，并非全部可用于数据存储。因此，可用于存储数据的实际容量小于产品上所标的数值。如需详细信息，请参阅 Kingston 闪存指南。
4. Kingston 闪存卡经过精心设计和严格测试，可兼容消费级市场产品。对于超出日常消费类用途的任何 OEM 合作机会或特殊应用项目，建议您直接联系金士顿。如需了解有关用途的更多信息，请参阅闪存指南。
5. 通过 IEC/EN 60529 IPX7 认证，可以在水深 1 米处持续浸泡长达 30 分钟。
6. 可承受 -40°C 至 85°C 的温度范围。
7. 基于 MIL-STD-883H、METHOD 2002.5 军事标准测试方法。
8. 抵御 X 光暴露，基于 ISO7816-1 指南。



本文件如有变更，恕不另行通知。
©2023 Kingston Technology Far East Corp. (Asia Headquarters) No. 1-5, Li-Hsin Rd. 1, Science Park, Hsin Chu, Taiwan
保留所有权利。所有商标和注册商标均为各所有人之财产。MKD-461 CN

Kingston
TECHNOLOGY